

05.4;09

©1994

**ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫМИ
 $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ МИКРОМОСТИКАМИ
НА БИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ
ИЗ $NdGaO_3$**

*A. В. Андреев, Ю. Я. Дивин, В. Н. Губанков,
И. М. Котелянский, В. Б. Кравченко, С. Г. Зыбцев,
Е. А. Степанцов*

Одним из наиболее перспективных типов джозефсоновских ВТСП переходов для применения в качестве чувствительных детекторов излучения являются тонкопленочные эпитаксиальные $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ микромостики на бикристаллических подложках (МБП). Данный тип переходов характеризуется возможностью контроля электрических параметров посредством изменения угла разориентации бикристаллической подложки [1,2] и толщины пленки. Изучение джозефсоновской генерации в различных типах ВТСП переходов [3,4] показало, что ширина линии джозефсоновской генерации в МБП может определяться только широкополосными тепловыми флуктуациями, в то время как для других типов переходов могут быть существенными низкочастотные флуктуации критического тока. МБП могут рассматриваться как наиболее подходящий объект для детального изучения микроволновых свойств ВТСП джозефсоновских переходов и высокочастотных применений ВТСП в электронике, если они будут приготавливаться на подложках, имеющих гораздо меньшее значение диэлектрической проницаемости ϵ , чем $SrTiO_3$, в настоящее время наиболее часто применяемый материал для бикристаллических подложек. Бездвойниковый монокристаллический $NdGaO_3$ может быть хорошим кандидатом для приготовления высококачественных МБП для высокочастотных применений благодаря гораздо меньшей диэлектрической проницаемости ($\epsilon \approx 20$) и, кроме того, лучшим согласованием кристаллической решетки с $YBa_2Cu_3O_{7-x}$.

В данной работе представлены результаты изучения нестационарного эффекта Джозефсона в тонкопленочных $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ микромостиках, приготовленных на бикристаллических подложках $NdGaO_3$, и обсуждаются возможности их применения для детектирования электромагнитного излучения миллиметрового диапазона.

Бикристаллические подложки создавались твердофазным сращиванием [5] двух монокристаллов NdGaO₃ в данной взаимной кристаллической разориентации. Данная разориентация характеризуется поворотом кристаллических решеток обоих кристаллов из параллельного положения вокруг их общей оси [100] в противоположные стороны на 18.4°. При этом их плоскости (001) оставались параллельными друг другу. Полученные в результате сращивания кристаллические композиты, содержащие искусственную межзеренную границу, распиливались на перпендикулярные этой границе тонкие (0.5 мм) пластинки. Подложки получались их химико-механической полировкой. Угол разориентации был выбран равным $2 \cdot 18.4^\circ$ для формирования в YBa₂Cu₃O_{7-x} пленке низкоэнергетической межзеренной границы с решеткой совпадающих узлов $\sum 10$, характеризуемой повышенной когерентностью.

YBa₂Cu₃O_{7-x} пленка толщиной 150 нм наносилась на подложку импульсным лазерным напылением. Мостики формировались фотолитографией. Геометрия эксперимента обеспечивала плохое согласование образца с волноводом, что гарантировало близкий к автономному режим работы контакта. Для измерения отклика перехода на СВЧ излучение использовалась методика синхронного детектирования с модуляцией мощности падающего излучения. Для уменьшения уровня наводок все электрические соединения, идущие к образцу, были отфильтрованы, а источник тока смещения и предварительный усилитель напряжения питались от батарей. Сбор данных осуществлялся платой аналого-цифровых преобразователей, управляемых персональным компьютером.

На рис. 1, а представлена вольт-амперная характеристика (ВАХ) (кривая 1), отклик на малый СВЧ сигнал с частотой $f = 77.90$ ГГц (кривая 2), и дифференциальное сопротивление (кривая 3) МБП шириной 5 мкм при температуре 10 К. ВАХ перехода имеет гиперболическую форму, что подтверждается видом кривой дифференциального сопротивления. Критический ток образца составляет $I_c = 32$ мкА, нормальное сопротивление $R_n = 4.5$ Ом ($V_c = 144$ мкВ). При малых напряжениях отклик на СВЧ излучение пропорционален дифференциальному сопротивлению, а в области напряжений $V \approx hf/2e$ имеет характерную нечетнорезонансную особенность (селективный отклик), связанную с синхронизацией внешним излучением собственной генерации перехода. Отсутствие резонансов при напряжениях $V_n \approx nhf/2e$ показывает, что отклик измерялся действительно в режиме малого сигнала, а отсутствие резонансов при $V_{1/n} \approx hf/n2e$ указывает на синусоидальную зависи-

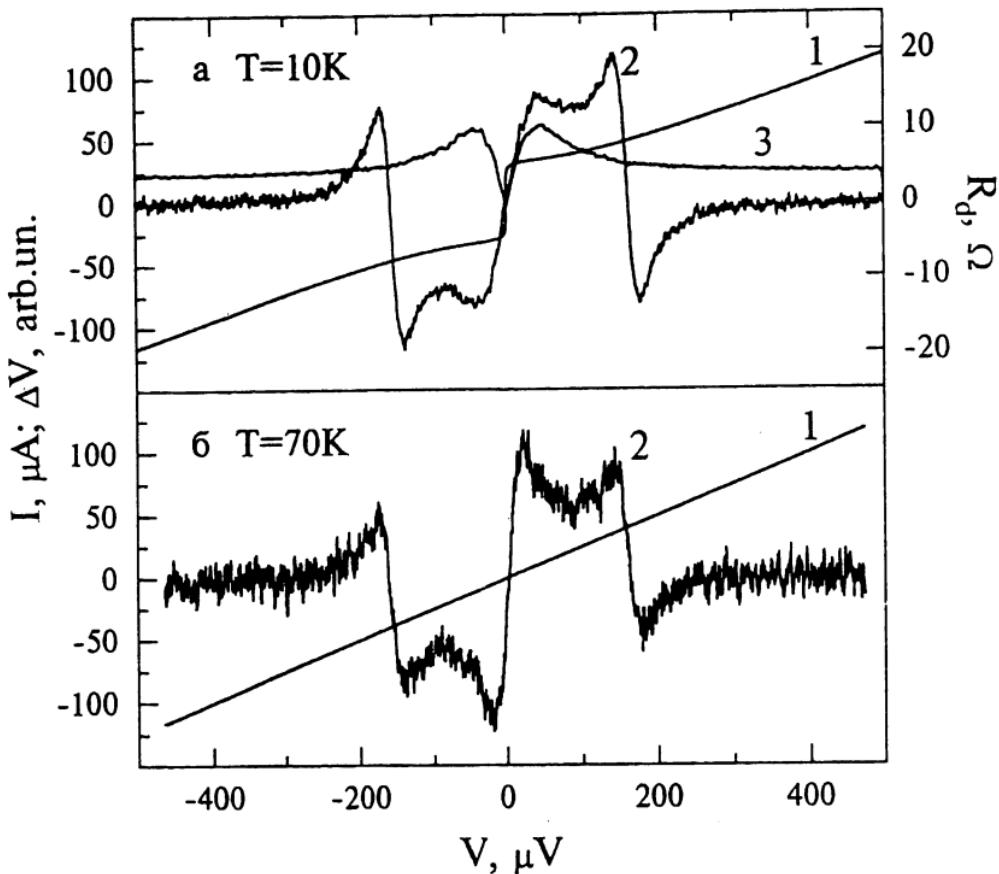


Рис. 1. ВАХ (кривая 1), отклик на малый СВЧ сигнал с частотой $f = 77.90$ ГГц (кривая 2) и дифференциальное сопротивление R_d (кривая 3) $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ МБП шириной 5 мкм при температуре а — 10, б — 70 К.

мость сверхтока от разности фаз. Вольт-ваттная чувствительность в селективном режиме, приведенная к мощности, поглощенной в переходе, составляла $S_v = 1.1 \cdot 10^5$ В/Вт, что дает значение $\text{NEP} = 2.7 \cdot 10^{-14}$ Вт/ГГц $^{1/2}$. Аналогичная форма отклика сохранялась при повышении температуры вплоть до азотных, что иллюстрирует рис. 1, б, на котором представлены ВАХ (кривая 1) и отклик (кривая 2) этого же перехода при температуре $T = 70$ К. Несмотря на то, что критический ток мал и размыт флуктуациями так, что ВАХ представляет собой близкую к прямой линии, отклик на излучение сохраняет все особенности: пропорциональность дифференциальному сопротивлению при малых значениях напряжения и нечетно-резонансную особенность при $V \approx hf/2e$.

Из селективного отклика джозефсоновского перехода на малое воздействие можно получить значение ширины линии джозефсоновой генерации $\delta f = \Delta V 2e/h$, где ΔV — разница между напряжениями, соответствующими максимуму и

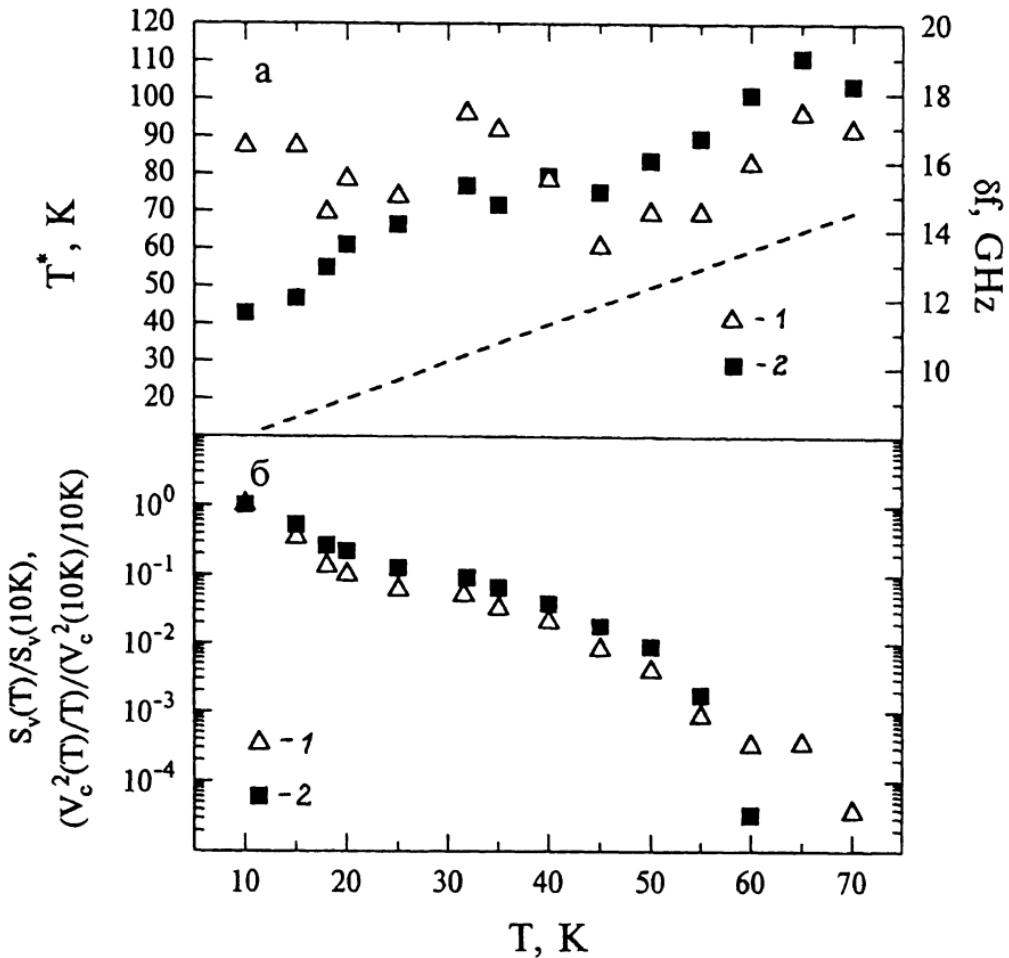


Рис. 2. Температурная зависимость: а — ширины линии джозефсоновской генерации δf (1) и эффективной шумовой температуры T^* (2); б — вольт-ваттной чувствительности (1) и величины V_c^2/T (2), нормированных на их значения при $T = 10$ К, для $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ МБП шириной 5 мкм.

минимуму селективного отклика. В случае широкоплоских тепловых флюктуаций и резистивной модели ширина линии джозефсоновской генерации определяется формулой:

$$\delta f = 4\pi \left(\frac{2e}{h}\right)^2 kT \frac{R_d^2}{R_n} \left(1 + \frac{I_c^2}{2I^2}\right), \quad (1)$$

где R_d и I_c — соответственно дифференциальное сопротивление и ток в точке смещения $V = hf/2e$. Так как ВАХ и отклик на малый сигнал близки к предсказываемым в резистивной модели, то для описания шумов в переходе можно применять формулу (1), используя вместо физической температуры T эффективную шумовую температуру T^* — та-

кую, чтобы формула (1) давала экспериментально измеренную ширину линии джозефсоновской генерации. Температурные зависимости ширины линии δf эффективной шумовой температуры T^* приведены на рис. 2, а. Из приведенного рисунка видно, что шумовая температура T^* превышает физическую температуру T во всем диапазоне и возрастает с увеличением последней, причем с увеличением температуры T относительная доля избыточных флуктуаций уменьшается. Так, при $T = 10$ К $T^*/T \approx 4.2$, а при $T = 70$ К $T^*/T \approx 1.5$. Наличие избыточных шумов может быть объяснено флуктуациями критического тока, так как для данного мостика $V_c = 144$ мкВ $\approx hf/2e$ и рабочая точка при измерении селективного отклика находится близко к критическому току. Из-за неоднородного распределения тока вдоль бикристаллической границы в МБП данный тип переходов может рассматриваться как многократный много контурный интерферометр, в котором кванты магнитного потока могут двигаться и пиннинговать, вызывая избыточные флуктуации критического тока.

Из формулы для отклика джозефсонового перехода на малый внешний сигнал [6], предполагая, что наведенный в переходе СВЧ ток связан с мощностью падающего излучения как $I_f^2 = KW/R_d$, где I_f — наведенный в переходе СВЧ ток, K — не зависящий от температуры коэффициент, учитывающий согласование перехода с внешней волноводной системой, W — мощность падающего излучения, можно получить температурную зависимость вольт-ваттной чувствительности в селективном режиме $S_v = \Delta V/W \sim \sim V_c^2/T$. На рис. 2, б приведены температурные зависимости вольт-ваттной чувствительности S_v и величины V_c^2/T . Для удобства сравнения обе величины нормированы на их значения при $T = 10$ К. Данные для зависимости V_c^2/T приведены в интервале 10–60 К, так как для более высоких температур определить значение V_c сложно из-за малой величины критического тока. Зависимость вольт-ваттной чувствительности S_v близка к зависимости V_c^2/T , что указывает на применимость резистивной модели для описания температурных зависимостей сигнальных свойств данного типа переходов в широком диапазоне температур.

Таким образом, тонкопленочные эпитаксиальные $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ микромостики, приготовленные на бикристаллических подложках из NdGaO_3 , проявляют джозефсоновские свойства, согласующиеся с предсказаниями резистивной модели в широком диапазоне температур от 10 до 70 К. Эффективная шумовая температура T^* , определенная из ширины линии джозефсоновской генерации, превышает

физическую температуру и возрастает с увеличением последней. Низкое значение диэлектрической проницаемости $\text{NdGaO}_3 \varepsilon \approx 20$ и высокая чувствительность к излучению ($\text{NEP} = 2.7 \cdot 10^{-14} \text{ Вт}/\text{Гц}^{1/2}$ при $T = 10 \text{ K}$) делает данные переходы перспективными для исследования высокочастотных свойств джозефсоновских ВТСП переходов и их применений в качестве чувствительных детекторов для миллиметрового и дальнего инфракрасного диапазона спектра.

Данная работа выполнена при поддержке Государственной программы Российской Федерации "Высокотемпературная сверхпроводимость", проект "Структура-2" и NATO Linkage Grant (project Lg-921040).

Список литературы

- [1] Gross R., Chaudhary P. // Principles and Applications of Superconducting Quantum Interference Devices. / Ed. by A. Barone. Singapore, 1991.
- [2] Dimos D., Chaudhary P., Mannhart J., LeGoues F.K. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 61. P. 219-222.
- [3] Divin Yu. Ya., Mygind J., Pedersen N.F., Chaudhary P. // Appl. Phys. Lett. 1992. V. 61. P. 3053-3055.
- [4] Divin Yu. Ya., Andreev A.V., Fischer G.M., Mygind J., Pedersen N.F., Herrmann K., Glyantsev V.N., Siegel M., Braginski A.L. // Appl. Phys. Lett. 1993. V. 62. P. 1295-1297.
- [5] Степанов Е.А. А.С. СССР № 1116100, 1982, БИ. 1984. № 36. С. 77.
- [6] Лихарев К.К., Ульрих Б.Т. // Системы с джозефсоновскими контактами. М., 1978. С. 446.

Институт радиотехники
и электроники

Институт кристаллографии
Москва

Поступило в Редакцию
21 марта 1994 г.